

SpecMetrix[®] 高级实验室涂层厚度测量系统

- ✓ 简化QA质量保证流程 ✓ 实时测量 ✓ 纳米级精度 ✓ 便于运输，易于升级

系统特点

- **灵活快速** - 模块化设计，具有从QA质量保证实验室到生产车间的即时测量能力
- **非接触式** - 测量过程无需接触涂层或基材，保持部件的完整性
- **绝对厚度测量** - 超精确的实时涂层厚度测量，可加快样品测试、数据采集和质量保证分析
- **适用各种基材** - 可测量透明、有色或着色基底湿/干样品
- **用途广泛** - 实时测量单层或双层涂层，或低至亚微米级别的离散层
- **安全无害** - 采用专有的非放射性和非侵入性 ROI 和 EXR 光学技术
- **环保** - 无损检测方法可减少废品、返工劳动力和能源成本
- **强大的SensorMetric软件** - 用户友好、方便使用的软件包可自动将所有数据存储在 Excel[®] 或工厂网络中

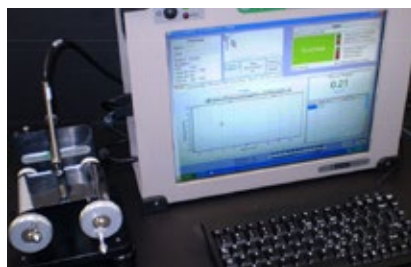


SpecMetrix 高级实验室涂层厚度测量系统可在单点和扫描模式下提供高度精确的非接触式样品检测

提供更精确的涂层和层厚测量数据，简化QA质量保证测试并改进过程控制

SpecMetrix 高级实验室系统为样品上涂料和涂层的非接触、非破坏性以及实时厚度测量提供了**更高标准**。

该系统旨在**简化QA质量保证流程**，凭借其独特的能力，可以纳米级精度识别和量化绝对薄涂层或层厚，因此成为实验室首选的分析工具。SpecMetrix 高级实验室系统能够加速离线样品测试，并显著提升原材料和成品的检验质量。

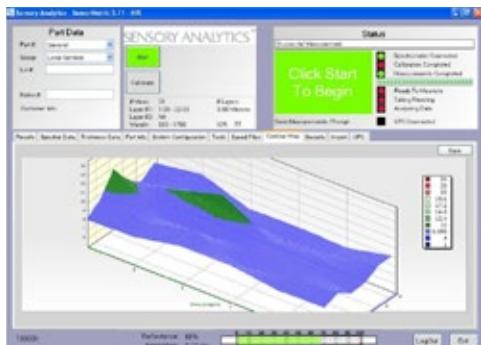


实现涂覆平面样品和零部件的实时离线测试



实验室配件包括样品测试台、样品固定架和实验室专用探头

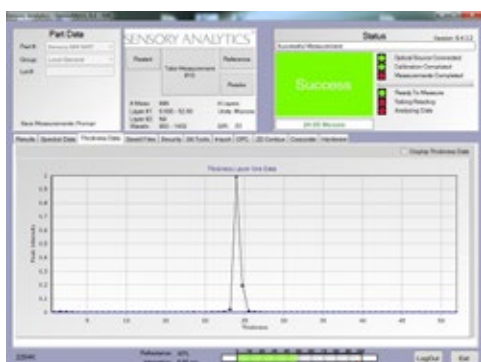
可靠且可重复的系统，提供更精确的涂层质量 质量保证和测试数据



配备 2D 和 3D 图形的绘图软件，用于对涂层厚度和膜重分布进行可视化分析



模块化设计便于系统重新配置和升级



可同时测量多个涂覆层，并显示单个层及
各层组合的厚度峰值

技术规格

测量范围:	0.2 至 250 微米 (涂层厚度)
精度:	涂层厚度的 +/- 1% (标称值)* <small>*所提供的精度数字是基于在 0.2 至 250 微米的整个测量范围内使用 NIST 可追溯厚度标准进行的精度验证。</small>
测量速度:	高达每秒 100 次
温度范围:	0°C 至 45°C
输出单位:	微米 microns 密耳 mils 毫克/平方英寸 mg/in ² 毫克/4平方英寸 mg/4in ² 克/平方米 g/m ² 毫克/平方厘米 mg/cm ² 磅/令 lbs/ream
操作系统:	Windows® 平台
产地:	美国制造
认证:	CE 已获批 SP 已获批 UL 已获批

可选系统配置

- 用于定期在线使用的增强型实验室系统
- 用于连续测量的在线系统
- 半自动和全自动 ACS 容器涂层质量保证系统
- 板材或成卷带材样品移动车



注：本设备及其使用方法受美国专利号 6,674,533、7,128,985、7,274,463、7,365,865 和 7,537,681 的保护，另有其他美国外国专利正在申请中。所有商标均被视为其所有者的财产。SpecMetrix® 是 Sensory Analytics 的商标。保留所有权利。Windows® 和 Excel® 是微软公司的商标。